年月日 25 10 31 25 019 ペ-No.

坂研がウエハー段差計

測定分野で世界シェア20%を目指す。 る。45、65、85のウエハーに対応す 販売し、将来的には半導体ウエハーの段差 る。価格は個別見積もり。初年度に10台を パターン、配線層などの段差を計測でき ベ100倍程度の精度で薄膜やエッチング 郎社長)は、業界初となる直動式の検出方 法を用いた半導体ウエハーの接触式段差計 「NT1520」 を発売した。 従来品と比 小坂研究所(東京都千代田区、小坂伊

高精度かつ短時間で測定できる 接触式段差計NT1520

レバー式。測定部の両 |ため、 円弧分の誤差が |を直接計測する。 分解 |近く 精度を 高められ 従来の段差測定法は |支点を中心にして動く |く、 ウエハー上の段差 | バー式と比べ100倍 能は0・1ヶが(ナノ る。また検査処理時間 直動方式は支点がな|は10億分の1)で、レ 一計測できる非接触式段 今後は接触式でのノウ ーなどを用いて素早く ハウを生かし、レーザ もそれぞれ用意した。

端がシーソーのように一生じていた。

にした。 度と大幅な短縮を可能 が従来品の2分の1程 |差計の発売も予定す

600 がが角ウエハー ウエハーに対応できる 向けの NT6060 けの「NT3030」、 及が予測される12秒向 同製品のほか、今後普 す手間を削減できる。 物(ワーク)を置き直 できるため、加工対象 軸・Y軸の両軸を測定 0万分の1)。またX 绍於(マイクロは10 の最大範囲は1300 4だ・6だ・8だの 測定可能な高さ方向 造・販売を手がける。 式段差計を開発した。 体ウエハー向けの接触 に技術を転用し、半導 の測定機を開発。さら 術を転用し、00年ごろ 機を開発した。その技 スクの表面形状の測定 0年ごろにハードディ 自動機器、包装機の製 精密機器や流体機器、 スプレー(FPD)向け にフラットパネルディ 同社は段差計のほか、 小坂研究所は198

無断転載・複写禁止 ㈱日刊工業新聞社